10/722,527



## BREVET D'INVENTION

#### CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le \_\_\_\_\_\_

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr

No. 



## **BREVET D'INVENTION** CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Féléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54	Remplir imperativement la zeme page.  Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire  DB 540 W/1906C		
Réservé à l'INPI	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE		
REMISE DES PIÈCES V 2003	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE		
75 INPLIPARIS	FERAY LENNE CONSEIL		
0301499	FERAT LENNE CONSEIL		
N° D'ENREGISTREMENT	44/52, rue de la Justice		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	75020 PARIS		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 0 7 FEV. 2003			
Vos références pour ce dossier (facultatif) P000456AL/PL			
Confirmation d'un dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie		
2 NATURE DE LA DEMANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes		
Demande de brevet	[X]		
Demande de certificat d'utilité			
Demande divisionnaire			
Demande divisionnane			
Demande de brevet initial	P N° Date		
ou demande de certificat d'utilité initial	e N° Date		
Transformation d'une demande de			
brevet européen Demande de brevet initiale  TITRE DE L'INVENTION (200 caractères			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation FRANCE Date 10 / 12 / 2002 N° 0215590		
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE			
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation Date N°		
	Date		
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation  Date N°		
	Date		
5 DEMANDEUR	S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»		
Nom ou dénomination sociale	ALSTOM		
Prénoms			
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
	25, avenue Kléber		
Adresse			
Code postal et ville	75116 PARIS		
Pays	France		
Nationalité	Française		
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

	Di > MAIDI			
ueu 75 INP1 P	<sup>2</sup> ARIS			
N° D'ENREGISTREMENT	0301499			
national attribué par l'		<u> </u>		
Vos références po (facultatif)	our ce dossier :	P000456/AL/PL		DB 540 W /1
6 MANDATAIRE				
Nom		LENNE		
Prénom		Laurence		•
Cabinet ou Société		FERAY LENNE CONSEIN	L	
	permanent et/ou			
de lien contract				
Adresse	Rue	44/52, rue de la Justice		
	Code postal et ville	75020 PARIS		
N° de téléphone		01.53.39.93.93		
N° de télécopie		01.53.39.93.83		
Adresse électror		mail@feraylenne.com		
7 INVENTEUR (S	<b>i)</b>		V	
Les inventeurs s	sont les demandeurs	Oui  Non Dans ce cas four	rnir une désig	nation d'inventeur(s) séparée
8 RAPPORT DE R	RECHERCHE			vet (y compris division et transformation
	Établissement immédiat ou établissement différé	×		O Tampina anticon of a discommunity
Paiement échelo	onné de la redevance	Paiement en deux verseme Oui Non	ents, uniquen	nent pour les personnes physiques
9 RÉDUCTION DU	•	Uniquement pour les perso	onnes physiqu	100
DES REDEVANO	CES	Requise pour la première	fois pour cette	invention (joindre un avis de non-imposition)
		Requise antérieurement à pour cette invention ou ind	ce dépôt (join	ndre une copie de la décision d'admission
Si vous avez uti indiquez le nom	ilisé l'imprimé «Suite», nbre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU	Profesion			
OU DU MANDAT	DEMANUEUK TAIRF	1	D	VISA DE LA PRÉFECTURE
(Nom et qualité			<b>一</b>	OU DE L'INPI
Laurence Lenne CPI No. 01,-0101		1 Um		
				MME BLANCANE UX

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

# PROCEDE POUR DIAGNOSTIQUER UN DEFAUT SUR UN ENROULEMENT DE TRANSFORMATEUR

La présente invention concerne un procédé pour diagnostiquer un défaut sur un enroulement de transformateur utilisant une analyse de réponse en fréquence ou FRA (Frequence Response Analysis en anglais). La présente invention est plus particulièrement adaptée aux transformateurs de puissance.

Les transformateurs de puissance (tels que des transformateurs ayant des tensions primaires de plusieurs centaines de kV et des puissances délivrées allant de quelques MVA à plusieurs centaines de MVA) sont des dispositifs extrêmement coûteux dans les systèmes d'interconnexion des réseaux de transmission. Il est donc très utile de pouvoir garder en service ces transformateurs le plus longtemps possible, une panne ou un défaut du transformateur pouvant avoir des conséquences économiques importantes dues à l'arrêt du réseau de distribution.

En outre, des défauts tels que des courts-circuits peuvent entraîner des risques d'explosion ou d'incendie.

Il est donc très important de pouvoir déterminer la présence de 20 défaut lié à l'enroulement d'un transformateur.

15

Une solution connue à ce problème consiste à utiliser une analyse de réponse en fréquence appelée usuellement FRA (Frequency Response Analysis en anglais). Cette technique consiste à mesurer l'impédance d'un enroulement de transformateur sur une large gamme de fréquence et à comparer le résultat de ces mesures avec un ensemble de référence. Afin de mesurer l'impédance en fonction de la

fréquence, on peut effectuer un balayage en fréquence en utilisant un signal sinusoïdal.

Ainsi, la figure 1 représente un schéma de principe d'un circuit 1 d'analyse en fréquence d'une impédance correspondant à 5 l'impédance d'un enroulement de transformateur à mesurer.

Le circuit 1 comporte :

- un analyseur de réseau 2,
- trois impédances de test de même valeur Z1,
- une impédance ZT correspondant à l'impédance d'un
   enroulement de transformateur à mesurer.

L'analyseur de réseau 2 génère un signal S de mesure. Le signal S de mesure est un signal sinusoïdal balayé en fréquence. Les impédances Z1 sont par exemple les impédances des câbles de mesure et ont généralement une valeur égale à 50 Ohms. R est le signal mesuré entre la première extrémité de ZT et la masse. T est le signal mesuré entre la deuxième extrémité de ZT et la masse. L'analyseur 2 représente ensuite en fonction de la fréquence le gain en tension k défini par la relation suivante :

$$k = 20\log_{10}\left(\frac{T}{R}\right)$$
.

Le gain k contient les informations nécessaires à l'étude de l'impédance ZT et vaut :  $k = 20\log_{10}\left(\frac{Z1}{Z1+ZT}\right)$ .

Dans le cas d'une impédance Z1 égale à 50 Ohms, on a ainsi :

$$k = 20\log_{10}\left(\frac{50}{50 + ZT}\right).$$

L'impédance est mesurée sur une gamme très large de fréquence qui peut aller de quelques Hz à une dizaine de MHz.

La même mesure doit être effectuée sur un enroulement de référence. Cet enroulement de référence peut être soit une autre phase pour laquelle on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de défaut, soit le même enroulement sans défaut mesuré auparavant, soit l'enroulement d'un transformateur identique. On obtient donc également un gain k' en fonction de la fréquence correspondant à cet enroulement de référence.

Une première solution consiste alors à examiner à l'œil les différences entre les courbes représentant k et k' en fonction de la fréquence. Cette solution présente cependant certains problèmes.

· ·

10

15

20

En effet, l'examen à l'œil effectué par un expert peut présenter une grande subjectivité et manquer de transparence.

Une deuxième solution consiste à calculer des indicateurs statistiques permettant de mettre en évidence les différences entre les deux courbes. De tels indicateurs statistiques sont par exemple les coefficients de corrélation calculés dans différentes gammes de fréquences.

Toutefois, l'utilisation de ces indicateurs statistiques pose également certains problèmes.

Ainsi, certains défauts ne peuvent pas être identifiés ; c'est le cas par exemple d'une mise à la terre du circuit magnétique du transformateur ou d'un courant de circulation produisant un échauffement de l'enroulement.

De même, cette utilisation des indicateurs statistiques peut conduire à confondre certains défauts ; par exemple, une mauvaise mise à la terre de la cuve du transformateur peut être confondue avec un endommagement de l'enroulement.

La présente invention vise à fournir un procédé pour diagnostiquer un défaut sur un enroulement de transformateur permettant à la fois d'augmenter le nombre de défauts détectables et de distinguer les différents défauts entre eux.

5

La présente invention propose à cet effet un procédé pour diagnostiquer un défaut sur un enroulement de transformateur comportant les étapes suivantes :

- mesure de l'impédance dudit enroulement en fonction de la fréquence, ladite mesure étant représentée sous la forme d'un premier gain en tension,
- comparaison de ladite mesure de l'impédance avec une mesure de référence représentée sous la forme d'un deuxième gain en tension, ladite comparaison incluant une étape de calcul de trois premiers paramètres, chacun desdits trois premiers paramètres étant un coefficient de corrélation desdits premier et deuxième gain dans trois gammes de fréquence différentes,

ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comporte une étape de détermination de la variation relative d'au moins un quatrième paramètre, ledit quatrième paramètre étant une grandeur physique caractéristique dudit transformateur, ladite variation relative étant obtenue en comparant lesdits premier et deuxième gains.

Grâce à l'invention, on combine les trois coefficients de corrélation avec la variation relative d'au moins un quatrième paramètre permettant d'identifier certains défauts non détectés par les valeurs des coefficients de corrélation. Selon la valeur de la variation relative de ce quatrième paramètre, il est également possible de lever une incertitude entre différents défauts possibles.

Avantageusement, ledit quatrième paramètre est choisi parmi le gain minimal, la fréquence de résonance fondamentale ou le nombre de fréquences de résonance présentes au-delà d'une fréquence prédéterminée.

Avantageusement, ledit gain minimal est déterminé pour une fréquence inférieure à 10 kHz.

Le gain minimal se définit comme la valeur minimale prise par le gain en tension k tel que décrit en référence à la figure 1 en fonction de la fréquence de mesure ; le gain minimal à déterminer est le gain minimal pour une fréquence inférieure à 10 kHz. Il se peut en effet que le gain prenne une valeur minimale pour une fréquence plus élevée mais cette valeur est moins pertinente pour l'identification des défauts.

Avantageusement, lesdites trois gammes de fréquence différentes sont respectivement [1kHz-10kHz], [10kHz-100kHz] et [100kHz-1MHz].

20

Il apparaît en effet que les coefficients de corrélation calculés en dessous de 1kHz sont moins pertinents et que ceux calculés audelà de 1MHz donnent des informations peu fiables. Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, ledit procédé comporte une étape de détermination de la variation relative d'au moins un cinquième et un sixième paramètre, lesdits cinquième et sixième paramètres étant caractéristiques dudit transformateur, ladite variation relative étant obtenue en comparant lesdits premier et deuxième gains.

Selon ce mode de réalisation, ledit quatrième paramètre est le gain minimal, ledit cinquième paramètre est la fréquence de résonance fondamentale et ledit sixième paramètre est le nombre de fréquences de résonance présentes au-delà d'une fréquence prédéterminée.

De manière extrêmement avantageuse, ledit procédé comporte une étape de détermination d'une pluralité de codes de diagnostic, chacun desdits codes indiquant l'appartenance d'un desdits paramètres à une gamme de valeurs prédéterminée.

Selon ce dernier mode de réalisation, ledit procédé comporte une étape de détermination de la présence d'un défaut et d'identification dudit défaut en fonction de ladite pluralité de codes de diagnostic.

Avantageusement, ladite étape de détermination de la présence d'un défaut et d'identification dudit défaut se fait par comparaison de ladite pluralité de codes avec des codes enregistrés dans une table de recherche.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante d'un mode de réalisation de l'invention, donné à titre illustratif et nullement limitatif.

Dans les figures suivantes :

- La figure 1 représente schématiquement un circuit d'analyse de réponse en fréquence d'une impédance,
- La figure 2 représente schématiquement un transformateur triphasé,
- La figure 3 représente les gains respectifs en fonction de la fréquence de deux enroulements haute tension de deux phases d'un transformateur triphasé.

La figure 1 a déjà été décrite en relation avec l'état de la technique. Les mesures FRA présentées par la suite seront toujours réalisées à partir d'un circuit d'analyse tel que représenté en figure 1.

La figure 2 représente schématiquement un transformateur triphasé 3.

Le transformateur triphasé 3 comprend :

- un circuit magnétique 4,
- 15 une cuve 5,
  - trois enroulements basse tension 6,
  - trois enroulements haute tension 7.

Chaque couple d'enroulement haute et basse tension correspond à une phase du transformateur associée à un noyau 9 du circuit 4. Les trois phases du transformateur seront respectivement notées par la suite A, B et C.

Le circuit magnétique 4 et la cuve 5 sont reliés par une liaison 8 et sont à la masse.

Trois mesures d'impédance peuvent être effectuées 25 respectivement pour la haute et la basse tension.

Ainsi, si on suspecte un défaut sur l'un des enroulements haute tension du transformateur, on mesure le gain de cet enroulement en fonction de la fréquence, on effectue la même mesure pour un autre enroulement haute fréquence et on compare les gains respectifs de ces deux enroulements. Notons qu'une troisième mesure est également possible en utilisant le troisième enroulement haute fréquence.

Notons que l'on peut également effectuer une comparaison entre les mesures sur l'enroulement soupçonné et des mesures réalisées antérieurement sur le même enroulement. On peut aussi faire une comparaison entre les mesures sur l'enroulement soupçonné et un enroulement équivalent d'un autre transformateur de la même conception.

A titre d'exemple, la figure 3 représente les gains k et k' 15 respectifs de deux enroulements haute tension des phases respectives C et A d'un transformateur triphasé tel que celui représenté en figure 2.

Les gains k et k' sont représentés pour une fréquence variant de 10 Hz à 1 MHz.

On suspecte la présence d'un défaut sur l'enroulement haute fréquence de la phase C correspondant au gain k.

Afin de déterminer la présence d'un éventuel défaut et de diagnostiquer ce dernier, le procédé selon l'invention comporte le calcul de six paramètres.

Les trois premiers paramètres sont les coefficients de corrélation  $\rho_1$ ,  $\rho_2$  et  $\rho_3$  de k et k' calculés sur les trois gammes de fréquences [1kHz-10kHz], [10kHz-100kHz] et [100kHz-1MHz].

Rappelons que le coefficient de corrélation  $\rho$  pour deux ensembles de n nombres X { $x_1$ ,  $x_2$ , ...,  $x_n$ } et Y { $y_1$ ,  $y_2$ , ...,  $y_n$ } est défini par la relation :

$$\rho = \sum_{x=i}^{n} x_{i} y_{i} / \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{i}^{2} \sum_{i=1}^{n} y_{i}^{2}} .$$

20

Le quatrième paramètre est défini comme le changement relatif du gain minimal  $CR_k$  en basse fréquence, c'est à dire à une valeur de fréquence inférieure à 10 kHz. Ainsi, si on appelle  $k_m$  le gain minimal de l'impédance à analyser et  $k'_m$  le gain minimal de l'impédance de référence, le coefficient de changement relatif de gain minimal  $CR_k$  est défini par la relation :  $CR_k = \frac{k_m}{k'_m}$ .

Le cinquième paramètre est défini comme le changement relatif de la fréquence de résonance fondamentale  $CR_f$ . La fréquence de résonance fondamentale est la première fréquence de résonance de chacun des gains k et k'. Si on appelle f et f' les fréquences de résonance fondamentales respectives des gains k et k', le paramètre  $CR_f$  est défini par la relation :  $CR_f = \frac{f}{f}$ .

Le sixième paramètre est défini comme le changement relatif du nombre de fréquences de résonance comprises entre 100 kHz et 1 MHz. Si on appelle n et n' le nombre de fréquences de résonance respectives de k et k' comprises entre 100 kHz et 1 MHz, le paramètre  $CR_n$  est défini par la relation :  $CR_n = \frac{n}{n}$ .

A chaque mesure du gain k comparée à une mesure du gain de référence k' correspond donc un sextuplet de paramètres  $\{\rho_1,\ \rho_2,\ \rho_3,$  5  $CR_k, CR_p, CR_n\}$ .

Ces paramètres peuvent être calculés soit en utilisant un outil informatique soit par un opérateur en utilisant une feuille MSExcel® ou un autre tableur.

Ainsi, en calculant ces paramètres pour les courbes 10 représentées en figure 3, on obtient :

$$\rho_1 = 0.7483$$
 $\rho_2 = 0.9797$ 
 $\rho_3 = 0.8577$ 
 $CR_k = 0.9717$ 

15 
$$CR_f = 1$$
  $CR_n = 1,8333$ .

On associe ensuite à chacune de ces valeurs un code ; l'ensemble de ces codes est résumé dans le tableau 1 ci-dessous.

Paramètres		Valeurs	Codes
ρ (valable pour toutes	les	Plage normale	0
gammes de fréquences)		>0,7000	1
		<0,7000	2
CR <sub>f</sub>		< Plage normale	9
		Suppression de la fréquence	8
·		Plage normale	0
		Plage normale - 1,25	1
,	i	1,25 – 1,5	2
		1,5 – 5	3
		>5	4
CR <sub>k</sub>		> Plage normale	9
		Plage normale	0
		>0,8	1
·		0,2 - 0,8	2
		<0,2	3
CR <sub>n</sub>	<del></del> -,	Plage normale	0
		> Plage normale	1
Tableau 1			

#### Tableau 1

Ainsi, on peut associer six codes à chaque sextuplet  $\{\rho_1,\ \rho_2,\ \rho_3,$   $CR_k,\ CR_f,\ CR_n\}.$ 

Le terme « plage normale » signifie que le paramètre se trouve 5 à l'intérieur d'une plage de variation dite normale.

Cette plage de variation normale dépend de l'enroulement utilisé pour la mesure de référence. Le tableau 2 résume les variations

normales dans le cas où le même enroulement est utilisé pour les mesures d'analyse et de référence.

Paramètres						Plages normales
ρ (valable	pour	toutes	les	gammes	de	[0,9950 - 1,0000]
fréquences)						_
CR <sub>f</sub>						[0,9000 - 1,1000]
CR <sub>k</sub>						
						$\left[\frac{k_m - 6}{k_m} - \frac{k_m + 6}{k_m}\right]$
CR <sub>n</sub>	***		-·· <u>-</u>			1,2000
Tableau 2						

Tableau 2

5

Le tableau 3 résume les variations normales dans le cas où un enroulement différent est utilisé pour la référence (cas de la figure 3).

Paramètres				······································		Plages normales
ρ (valable	pour	toutes	les	gammes	de	[0,9750 - 1,0000]
fréquences)						
CR,			<del></del>			[0,6500 – 1,5000]
CR <sub>k</sub>						$\left[\frac{k_m - 6}{k_m + 6} - \frac{k_m + 6}{k_m + 6}\right]$
						$\begin{bmatrix} \frac{m}{k_m} & \frac{m}{k_m} \end{bmatrix}$
CR <sub>n</sub>			- <del></del> -			1,2000
Toblesu 2		<del></del>				

Tableau 3

Les paramètres  $\{\rho_1, \rho_2, \rho_3, CR_k, CR_n\}$  pour les courbes représentées en figure 3 donnent donc les codes : 101001.

Lorsque les six codes sont déterminés, le procédé selon l'invention comporte une étape de comparaison de ces six codes avec des codes enregistrés dans une table de recherche telle que présentée dans le tableau 4.

Types de fautes				5	9	
	<del>ر</del> ت	ρ	р <sub>3</sub>	<u>ج</u>	ج چ چ	<del>ည</del> ်
	0	0	0	0	0	0
2) Mauvaise mise à la terre de la cuve (haute résistance)	0	0	0-1	C	C	C
3) Absence de mise à la terre de la cuve	0	c	,	0	,	o (
		,	-		5	>
o a la terre du circuit magnetique		0	0	6-0	0-1	0
5) Boucle fermée mise à la terre		0	0	6-0	0	C
6) Boucle fermée mise à un potentiel flottant			,	0		
		>	- 5	6-0 	0_	0
( ) Spire additionnelle en court-circuit (même phase)	0-1-2	0	0	3	2-3	0
8) Défaut entre bornes de l'enroulement (enroulement analyse) o		,	,	ļ		
	7-1-0	7-1-0	7-1-0	∞	m	<u>·</u>
			***************************************			
9) Défaut entre bornes de l'enroulement ( autre enroulement d'une 0	0-1-2	0-1-2	c	α	2	
même phase affecté)		J -		o.	າ	 > .
10) Inc enire as a series of I						
	0-1-5	0	0	0	0-1-2	
11) Plusieurs spires en court-circuit	0.1.0	,	,		$\dashv$	
				4	7	 o
0-1		0	0	2	0	0
	-					

Types de fautes	ρι	ρ <sub>2</sub>	p <sub>3</sub>	CR, CR	S. A.	S. R.
13) Court-circuit sur une autre phase que sur la seule phase 0-1	0-1	0	0	-	0	0
adjacente						
14) Enroulement déplacé ou flambage de l'enroulement intérieur	0-1	0-1	0	0	0	0
15) Enroulement endommagé	0	0	0-1	0	0	0-1
16) Enroulement déplacé et endommagé	0-1	0-1	0-1	0	0	0-1
17) Mauvaise continuité	0-1-2	0-1-2	0-1-2	0-1	6	0
18) Une des bornes de l'enroulement mesuré mise à la terre	1-2	0-1	0-1	0	0	0-1
19) Une des bornes d'une autre phase que celle de l'enroulement	1-2	0-1-2	0	0-6	0-1-2	0-1
mesuré mise à la terre						
20) Une des bornes d'un autre enroulement de la même phase que	0	0	0-1	0	0	0-1
l'enroulement mesuré mise à la terre						

ableau 4

La comparaison entre les paramètres calculés et la table de recherche telle que présentée dans le tableau 4 peut être réalisée par un programme informatique développé dans un environnement Matlab®.

L'explication suivante des défauts sera faite en référence à la figure 2.

Les défauts 2 et 3 correspondent à des mauvaises mises à la terre de la cuve 5 ; dans le cas du défaut 3, il s'agit d'une absence de mise à la terre et dans le cas du défaut 2, d'une mise à la terre avec une résistance élevée entre la cuve 5 et la terre (supérieure à 50 Ohms).

Le défaut 4 correspond à une absence de mise à la terre du circuit magnétique 4, c'est à dire à une rupture de la liaison 8.

Les défauts 5 et 6 correspondent à des boucles de courant de circulation mises respectivement à la terre et à un potentiel flottant ; ces boucles entraînent un échauffement du transformateur.

Le défaut 7 correspond à la présence d'une spire additionnelle créant un court circuit sur la phase à laquelle appartient l'enroulement à analyser.

Le défaut 8 correspond à un défaut entre les bornes de l'enroulement à analyser, c'est à dire un court-circuit de l'enroulement entier.

Le défaut 9 correspond à un défaut entre les bornes d'un enroulement appartenant à la même phase que l'enroulement à 25 analyser.

Le défaut 10 correspond à un court-circuit présent sur une spire des enroulements appartenant à la même phase que l'enroulement à analyser. Ce défaut produit un échauffement du transformateur.

Le défaut 11 correspond à un court-circuit présent sur plusieurs spires appartenant à la même phase que l'enroulement à analyser. Ce défaut produit un échauffement du transformateur.

5

20

Le défaut 12 correspond à un défaut de court-circuit tel que qu'un court circuit entre spires, entre bornes ou sur une spire additionnelle. Il indique que le défaut se trouve sur une phase à coté de celle où la mesure a été effectuée et que la phase où se trouve le défaut est la seule phase adjacente, c'est à dire immédiatement à coté de la phase où la mesure a été effectuée. Ainsi, si le défaut se trouve sur le noyau central, l'analyse des autres phases produira ce code car la phase centrale est bien la seule phase immédiatement à coté des phases de gauche et de droite.

4, -

. .

::,

La défaut 13 correspond également à un défaut de courtcircuit tel qu'un court circuit entre spires, entre bornes ou sur une spire additionnelle. Il indique cependant que le défaut n'est pas sur une phase unique se trouvant immédiatement à coté de la phase où la mesure a été effectuée. Ainsi, si le défaut se trouve sur le noyau de gauche, l'analyse de la phase centrale produira ce code car il y a bien deux phases immédiatement à coté de la phase centrale et non une seule. Le défaut 14 correspond à un déplacement axial de l'enroulement à analyser sans que ce dernier soit cependant trop endommagé localement ou à un flambage d'un enroulement intérieur.

Le défaut 15 correspond à un endommagement mécanique local sur l'enroulement à analyser.

Le défaut 16 cumule les défauts 14 et 15.

Le défaut 17 correspond à une mauvaise continuité électrique dans l'enroulement à analyser. Cette mauvaise continuité peut être liée à un mauvais contact de mesure.

Le défaut 18 correspond à la mise à la terre d'une des bornes de l'enroulement à analyser.

Le défaut 19 correspond à la mise à la terre d'une des bornes d'un enroulement appartenant à une autre phase que celle de l'enroulement à analyser.

Le défaut 20 correspond à la mise à la terre d'une des bornes d'un enroulement différent de l'enroulement à analyser mais appartenant à la même phase.

Les défauts 18, 19 et 20 sont davantage des défauts de mesure.

Ainsi, en comparant les codes 101001 associés aux courbes de la figure 3 avec les défauts listés dans le tableau 4, on en déduit la présence d'un défaut de type 16 ou 18. On peut écarter un problème de mesure de type 18 en refaisant la mesure et en déduire ou non la présence d'un défaut de type 16, c'est à dire d'un enroulement déplacé et endommagé.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit.

Notamment, les étapes de calcul de paramètres et de recherche dans la table de recherche réalisées par des moyens logiciels peuvent être également réalisées par des opérateurs.

De même, les valeurs des codes ont été données à titre indicatif mais peuvent être remplacées par d'autres valeurs adaptées à d'autres outils logiciels.

1

#### **REVENDICATIONS**

- 1. Procédé pour diagnostiquer un défaut sur un enroulement de transformateur comportant les étapes suivantes :
- mesure de l'impédance dudit enroulement en fonction de la fréquence, ladite mesure étant représentée sous la forme d'un premier gain (k) en tension,

5

10

- comparaison de ladite mesure de l'impédance avec une mesure de référence représentée sous la forme d'un deuxième gain (k') en tension, ladite comparaison incluant une étape de calcul de trois premiers paramètres, chacun desdits trois premiers paramètres étant un coefficient de corrélation (ρ<sub>1</sub>, ρ<sub>2</sub>, ρ<sub>3</sub>,) desdits premier et deuxième gains (k, k') dans trois gammes de fréquence différentes,
- ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comporte une étape de détermination de la variation relative d'au moins un quatrième paramètre (CR<sub>k</sub>, CR<sub>n</sub>, CR<sub>n</sub>), ledit quatrième paramètre étant une grandeur physique caractéristique dudit transformateur, ladite variation relative étant obtenue en comparant lesdits premier et deuxième gains (k, k').
- 20 2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que ledit quatrième paramètre est choisi parmi le gain minimal, la fréquence de résonance fondamentale ou le nombre de fréquences de résonance présentes au-delà d'une fréquence prédéterminée.

- Procédé selon la revendication précédente caractérisé en ce que ledit gain minimal est déterminé pour une fréquence inférieure à 10 kHz.
- 4. Procédé selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que lesdites trois gammes de fréquence différentes sont respectivement [1kHz-10kHz], [10kHz-100kHz] et [100kHz-1MHz].
- 5. Procédé selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape de détermination de la variation relative d'au moins un cinquième et un sixième paramètre, lesdits cinquième et sixième paramètres étant caractéristiques dudit transformateur, ladite variation relative étant obtenue en comparant lesdits premier et deuxième gain.
- 6. Procédé selon la revendication précédente caractérisé en ce que ledit quatrième paramètre est le gain minimal, ledit cinquième paramètre est la fréquence de résonance fondamentale et ledit sixième paramètre est le nombre de fréquences de résonance présentes au-delà d'une fréquence prédéterminée.

٩٠٠

- 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte une étape de détermination d'une pluralité de codes de diagnostic, chacun desdits codes indiquant l'appartenance d'un desdits paramètres à une gamme de valeurs prédéterminée.
- 8. Procédé selon la revendication précédente caractérisé en ce qu'il comporte une étape de détermination de la présence d'un défaut

- et d'identification dudit défaut en fonction de ladite pluralité de codes de diagnostic.
- Procédé selon la revendication précédente caractérisé en ce que ladite étape de détermination de la présence d'un défaut et d'identification dudit défaut se fait par comparaison de ladite pluralité de codes avec des codes enregistrés dans une table de recherche.

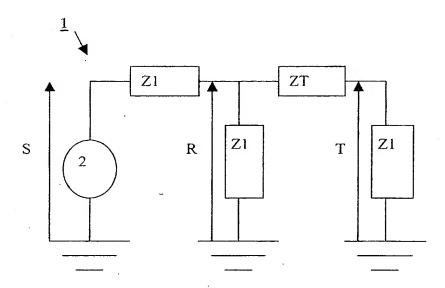


Figure 1

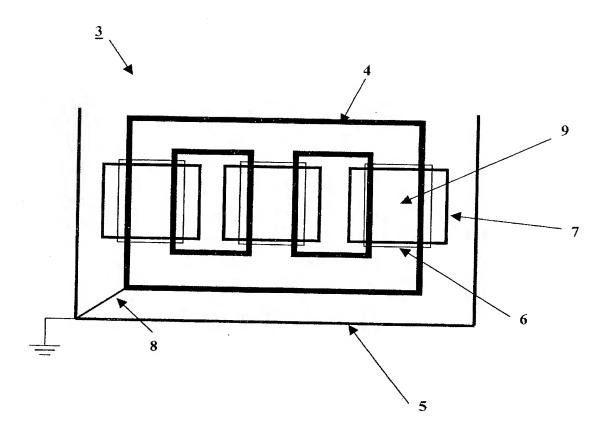


Figure 2

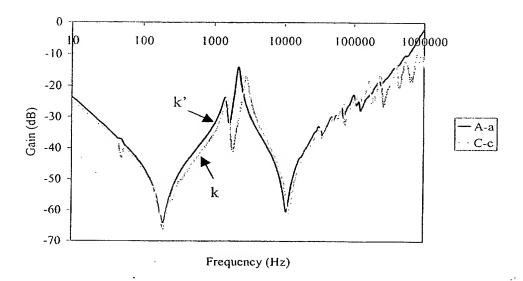
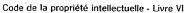


Figure 3



## **BREVET D'INVENTION**

#### CERTIFICAT D'UTILITÉ





#### DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

		Cet imprime est a rempiir lisiblement a l'encre noire DB 113 W /260
Vos références (facultatif)	s pour ce dossier	P000456/AL/PL
N° D'ENREGIS	TREMENT NATIONAL	03 01 499
TITRE DE L'IN	VENTION (200 caractères ou es	naces maximum)
		n enroulement de transformateur
LE(S) DEMAND	DEUR(S):	
ALSTOM		
25, avenue Klé 75116 PARIS	ber	
75116 PARIS FRANCE		
1101102		
DESIGNE(NT) utilisez un fori	EN TANT QU'INVENTEUR( mulaire identique et numéro	S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° $1/1$ » S'il y a plus de trois inventeurs, otez chaque page en indiquant le nombre total de pages).
Nom		RYDER
Prénoms		Simon Andrew
Adresse	Rue	36, avenue Simon Bolivar
	Code postal et ville	75019 PARIS .
Société d'appart	tenance (facultatif)	
Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appart	tenance (facultatif)	
Nom		
Prénoms '		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	·
Société d'apparte	enance (facultatif)	
DATE ET SIGNA DU (DES) DEMA OU DU MANDA (Nom et qualité Laurence Lenna CPI No. 01-010	ANDEUR(S) TAIRE é du signataire) e	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**3** F 7.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

Customer Number **22850** 703-413-3000

SERIAL NO.: 10/722,527
FILING DATE: 14 ovember 28,2003